



ケースレーインストゥルメンツ株式会社

〒105-0022 東京都港区海岸1-11-1  
ニューピア竹芝ノースタワー13F  
TEL (03)5733-7555・FAX (03)5733-7556  
<http://www.keithley.jp>

2007年4月18日

報道関係各位

ケースレーインストゥルメンツ株式会社  
マーケティング  
さとう かなえ  
佐藤 香苗  
[info.jp@keithley.com](mailto:info.jp@keithley.com)

## ケースレー 半導体試験のソリューション・ビジネスを強化、 試験効率を高める統合テストシステムを販売開始

高解像度画像はこちら：<http://www.ggcomm.com/KEI/ACS.JPG>

2007年4月18日 – 先進の電子計測器・システムの世界的リーダーである Keithley Instruments Inc. (NYSE : KEI) は、システムソリューション・ビジネスを強化、デバイス、ウェーハ、カセットレベルでの半導体特性評価向けの ACS (Automated Characterization Suite) 統合テストシステムの日本国内での販売を本日より開始した。新しい ACS テストシステムは、1つのソフトウェアパッケージをベースに高速な測定と優れたシステム柔軟性を提供し、様々な個々の試験アプリケーションニーズに応えていく。

ケースレーのACS統合テストシステムは、統合ソフトウェアパッケージAutomated Characterization Suiteと様々な試験測定器で構成され、システム全体でユニークな測定機能を実現する。

- 4200-SCS型半導体特性評価システム---I-V印加/測定機能と超短パルス試験パッケージにより先端半導体材料試験などのニーズに対応
- 2600シリーズ・システムソースメータ<sup>®</sup>---TSP-Link<sup>™</sup> と Test Script Processor (TSP)<sup>™</sup> により、オンザフライNBTIやオンウェーハ要素特性評価などで必要となるスケーラブルなI-Vチャンネル数のシステム、高速パラレル測定、複雑なシーケンスを実現

- 2400シリーズ・ソースメータ<sup>®</sup> は、ハイパワーMOSFETやディスプレイドライバなどで必要となる高電圧、大電流などの幅広いレンジをカバー
- 必要に応じてスイッチ、Cメータ、パルスジェネレータなどを組み合わせることによってACS統合テストシステムの機能がアップ

ACS統合テストシステムは、ベーシックなベンチトップ構成から、量産ライン用のフルラック構成まで柔軟に対応できる。

### 試験課題への対応

半導体試験の技術者は、数々の試験課題に直面している。微細CMOS、LDMOS、先端メモリなどの新技術には、さまざまな種類のユニークな測定や新しいテクニックが求められる。一方、新しい技術には、より短い時間とより少ないリソースでより多くの試験実行とデータ収集が求められる。今まで、半導体試験技術者は、主に柔軟性に優れユニークな測定機能を備えた測定器を使用していたが、製品化期間(タイムトゥマーケット)を劇的に短縮するには測定・解析ソフトウェアを内製または外注して開発しなければならず、開発期間短縮のネックになっていた。ケースレーのACS統合テストシステムは、測定器のユニークな測定機能、高い柔軟性をフル活用して自動化を実現するソフトウェアを提供することにより、これらの問題を一举に解決する。この新しいACSシステムは研究開発、技術開発、品質/信頼性保証、小規模生産試験などでの半導体パラメータ特性評価に理想的なソリューションである。

ウェーハまたはカセットレベルでの試験自動化は、無人試験、モデリングやプロセス検証のための大量な統計データサンプル収集を可能にし、評価効率を最大限に高める。ウェーハレベルでの自動化については、ケースレーのACS統合テストシステムはウェーハ記述ユーティリティとウェーハマップを備えている。ユーザは、統合テストプランを使ってウェーハ記述ファイルを簡単に構築できる。テスト実行中、色分けされたウェーハマップはリアルタイムに更新され、合否評価が表示される。試験結果をクリアに確認でき、テストの高生産性を保証する。

別の革新的な機能には、対話形式でのプローバ制御がある。これによりユーザは、テスト開発の際にACSソフトウェアを使ってウェーハの動きを制御し実際のストラクチャ上でテストセットアップを検証したり、ロットの傾向分析の際にウェーハ上の問題領域にナビゲートして手動で試験を実行できる。豊富な機種対応のドライバが、セミオート/フルオートプローバとのシームレスな統合を実現する。

ACS統合テストシステムは、ケースレーの半導体アプリケーションのノウハウとカスタマイズ経験に基づいて構成/統合された。ACS統合テストシステムはマクロ、スクリプト、カスタムGUIなどのテストルーチンの作成だけにとどまらず、ケーブル、スイッチ・プローブカードの適合や、インストール、トレーニング、アプリケーションサービスまで含めたトータルソリューションを提供し、システムソリューション・ビジネスを加速する。

### 価格と納期

価格と納期：構成やカスタマイズの内容によって異なるため、要問い合わせ

受注開始：即日

詳細： ケースレーの半導体試験ソリューションの詳細は、ケースレーインストルメンツ株式会社にお問い合わせください。

## お問い合わせ先

ケースレーインストルメンツ株式会社

東京：	03-5733-7555	(電話)
	03-5733-7556	(FAX)
	〒105-0022 東京都港区海岸1-11-1	
	ニューピア竹芝ノースタワー13 F	
大阪：	06-6190-0014	(電話)
	06-6190-0017	(FAX)
	〒564-0052 大阪府吹田市広芝町9番	
	第11 マイダビル	
E-mail:	info.jp@keithley.com	
Internet:	www.keithley.jp	

## ケースレーインストルメンツについて

半世紀以上にわたり世界の計測をリードしてきたケースレーインストルメンツは、工程管理、製造試験、開発設計、基礎研究での計測需要に応える電気測定ソリューションを DC から RF まで幅広く提供しています。ケースレーの先進のハードウェア、ソフトウェアは、全世界の技術者、研究者によって、最先端の材料研究、半導体デバイス、ウェーハ特性評価、電子部品やワイヤレスデバイスをはじめとする最終製品製造試験など、さまざまな局面で使用されています。ケースレーは、強みである測定技術とアプリケーションノウハウを併せ持つことにより、世界中のお客様の製品やプロセスの改善、市場投入時間を図るための支援を行っています。

本プレスリリースに記載されている製品名、会社名は、各所有会社の商標です。

###